

CEI 60749-4  
(Première édition – 2002)

DISPOSITIFS À SEMICONDUCTEURS –  
MÉTHODES D'ESSAIS MÉCANIQUES  
ET CLIMATIQUES –

Partie 4: Essai continu fortement accéléré  
de contrainte de chaleur humide (HAST)

IEC 60749-4  
(First edition – 2002)

SEMICONDUCTOR DEVICES –  
MECHANICAL AND CLIMATIC TEST METHODS –

Part 4: Damp heat, steady state, highly  
accelerated stress test (HAST)

## CORRIGENDUM 1

Page 2

*Au lieu de:*

Le comité a décidé que le contenu de cette publication ne sera pas modifié avant 2012.

*lire:*

Le comité a décidé que le contenu de cette publication ne sera pas modifié avant 2007.

Page 3

*Instead of:*

The committee has decided that the contents of this publication will remain unchanged until 2012.

*read:*

The committee has decided that the contents of this publication will remain unchanged until 2007.